

# 产品可靠性测试报告

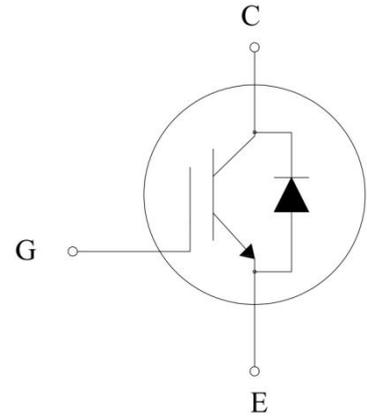
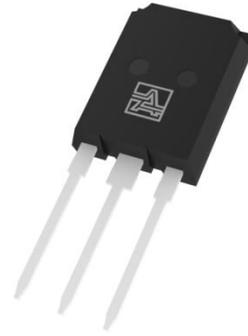
## 产品信息/ Product Information

Part No. : ADG040N12AT7

Lot No. : TQ2429005

Package : TO247 Plus

Test Date: 2024/8/6~2024/10/9



## 描述/ Description

该测试报告描述了可靠性方面的产品特性。

用于测试和鉴定的样本来自常规的产线批次，这些批次的产出经过了标准的制造和测试工艺流程并且符合所定义的规范要求。

本文中所概述的可靠性测试结果是基于符合目标应用所对应的 JEDEC 标准，并且可能参考类似产品所现有的鉴定测试结果。该参考的实行是基于对产品之间的结构相似性的证明。

## 测试鉴定评估结果/ Electrical Stress Test Results

依照 JEDEC 标准，测试鉴定评估结果合格。

测试项目		测试条件	测试时间	测试标准	数量/批次	测试结果
High Temp Reverse Bias 高温反向偏置试验	HTRB	Ta=150°C Vce=0.9*VDS (DC)	1000 hrs	JESD22-A108	77/1Lot	Pass
High Temp Gate Bias 高温栅偏试验	HTGB	Ta=Tvjop max Vge=±20V	1000 hrs	JESD22-A108	77/1Lot	Pass
High Humidity High Temperature Reverse Bias 高温、高湿反向偏置试验	H3TRB	Ta=85°C,85%RH Vds=100V	1000 hrs	JESD22-A101	77/1Lot	Pass
HV High Humidity High Temperature Reverse Bias 高温、高湿反向偏置试验	HV-H3TRB	Ta=85°C,85%RH Vds=0.8*VDS (DC)	1000 hrs	JESD22-A101	77/1Lot	Pass
Temperature Cycle 温度循环试验	TC	' -55°C/150°C; 15 min Dwell Time;	1000 Cycles	JESD22-A104	77/1Lot	Pass
Intermittent Operating Life 间歇寿命试验	IOL	ΔTj≥100°C, ON/OFF time By Package;	1000 hrs	MIL-STD-750 Method 1037	77/1Lot	Pass
Autoclave 高压加速试验	AC	121°C100%RH, 15Psi;	96 hrs	JESD22-A102	77/1Lot	Pass

#### 重要声明

在任何情况下，本文件中提供的信息都不应被视为任何条件或特征的保证。

对于本协议中所述的任何示例、提示或任何典型值以及/或任何有关产品应用的信息，合肥阿基米德电子科技有限公司在此不承担任何及所有诸如此类的保证和责任，包括但不限于对不侵犯任何第三方单位的知识产权的保证。

此外，本文件中提供的任何信息均应以客户遵守本文件中规定的义务为前提，包括有关客户产品和任何使用合肥阿基米德电子科技有限公司产品的客户应用所适用的任何合法要求、规范和标准。